


Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 物料检验工作指引-半导体元件	受控状态			
	文件编号	SS-QC-021	版 本	A
	页 号	1/8	生效日期	2004-4-8
<p>1.0 参考文件</p> <p>1.1 P/O 单；</p> <p>1.2 半导体元件规格；</p> <p>1.3 工程部所签发样板</p> <p>1.4 OT2 型晶体管特性图示仪使用说明书</p> <p>1.5 稳压二极管测试装置操作指引</p> <p>1.6 发光二极管测试装置操作指引</p> <p>2.0 所包括物料范围 晶体三极管/整流二极管/稳压二极管/发光二极管</p> <p>3.0 允收品质水平(MIL-STD-105E) AQL: Critical (极严重)0.0 Major(严重) 0.25 Minor (轻微) 1.0</p> <p>4.0 程序</p> <p>4.1 核对所进电子元件是否符合送货单和 P/O 单等收货资料要求</p> <p>4.2 按 MIL-STD-105E 普通检验水平 D、单次抽样 (检查元件尺寸之样品数见 4.3)</p> <p style="text-align: center;">操 作 标 准</p> <hr/> <p>4.3 检查元件尺寸: 参照半导体元件规格和 DE 所签发样品 依据特殊检验水平 若元件本体或引脚尺寸超出半导体规格 S-1 抽取样品数, 上要求值 Major 使用千分尺和游标 卡尺测量</p> <p>4.4 检查晶体三极管/ 整流二极管(整 参照半导体元件规格 流桥)等元件性能</p>				
编制		审核		审批

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 物料检验工作指引-半导体元件	受控状态			
	文件编号	SS-QC-021	版本	A
	页号	3/8	生效日期	2004-4-8
<p>操作标准</p> <hr/> <p>一发射极间峰值电压 从 X 轴上读得被测管的集电极一发射极间的反向击穿电压 BUCEO 若不能达到半导体元件规格上要求值 Major</p> <p>4.4.2 晶体三极管参数 I_{CEO} (见图 B)</p> <p>a 将 Y 电流/度、X 电压/度置于合适档级</p> <p>b 按要求值选择合适的电压档级和合适的功耗电阻以及将阶梯幅度/级开关置于电流/级合适档级</p> <p>c 调节峰值电压旋钮 从 Y 轴上读得被测管的集电极一发射极间的截止电流 I_{CEO} 若超过半导体 (NPN) 或右上方 (PNP 元件规格上要求值 Major) 的零点开始</p> <p>4.4.3 晶体三极管参数 β 测试 (见图 C)</p> <p>a 将 X 电压/度、置于  档级；电流/度置于合适档位</p> <p>b 调功耗电阻使被测管集电极电压达到要求值</p> <p>c 选择合适的阶梯幅度/级电流档</p>				
编制		审核		审批

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 物料检验工作指引-半导体元件	受控状态			
	文件编号	SS-QC-021	版本	A
	页号	5/8	生效日期	2004-4-8

4.9 被禁止使用物质的检查

凡是物料检验规格上有标识“禁用物质”的待检半导体元件，必须对相关供应商提供的被禁止使用物质的第三方化学分析报告予以检查，是否超过相关客户（如 Philips、Mattel 等）的要求，合格者予以放行，不合格者退回供应商。

编制		审核		审批	
----	--	----	--	----	--

注：后三页为图纸，原件粘贴处理